

書類名

図面

図1

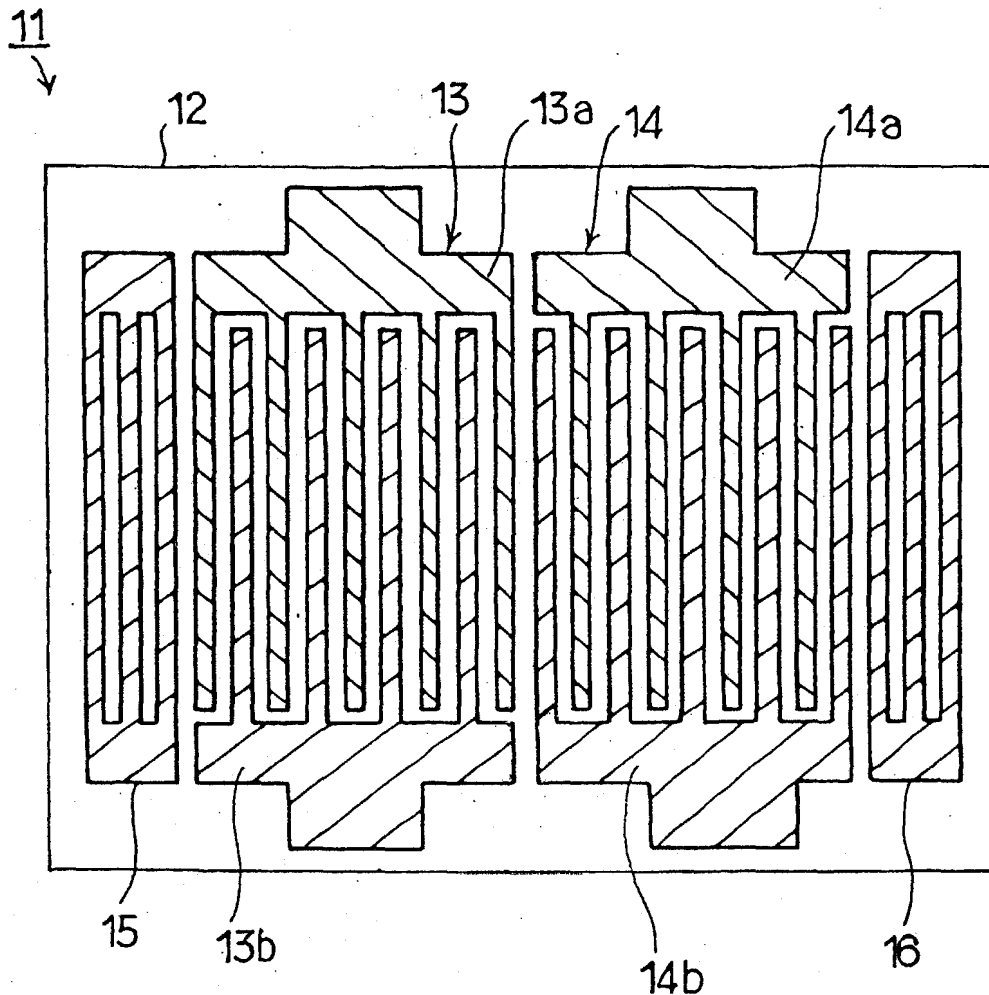
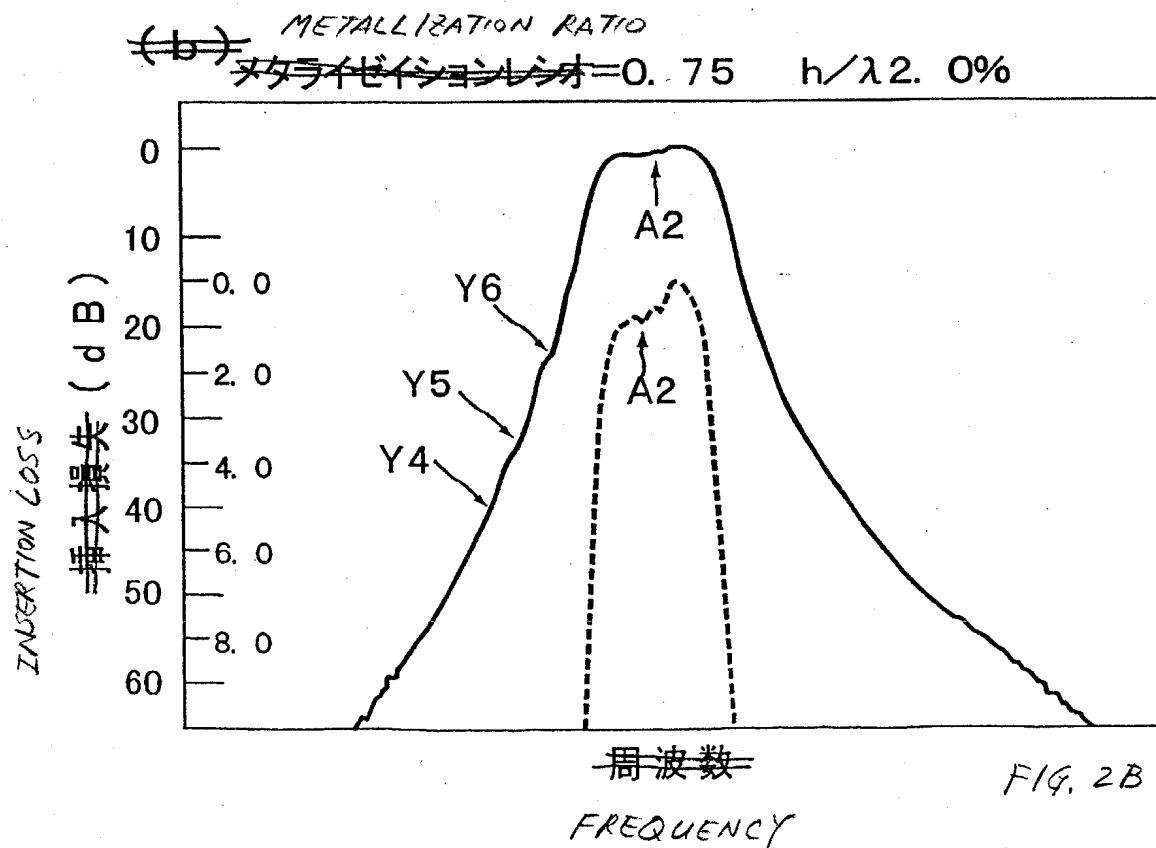
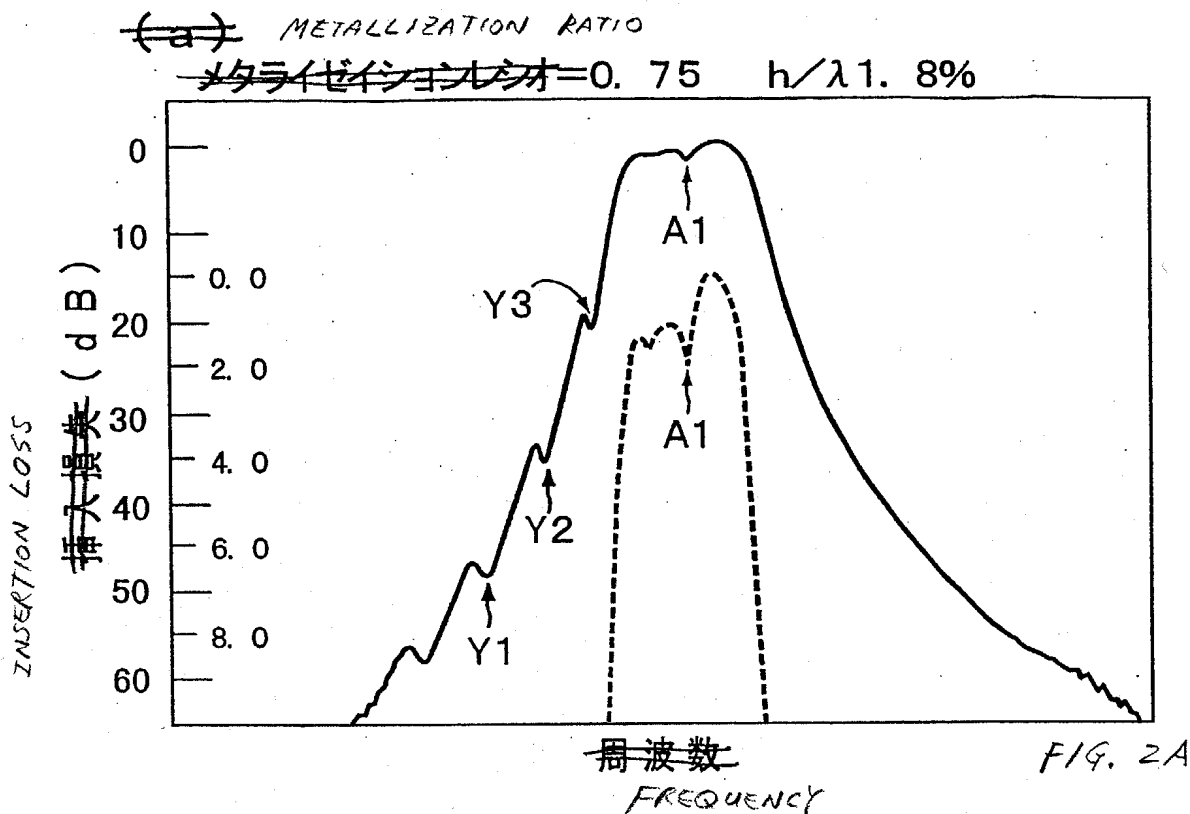


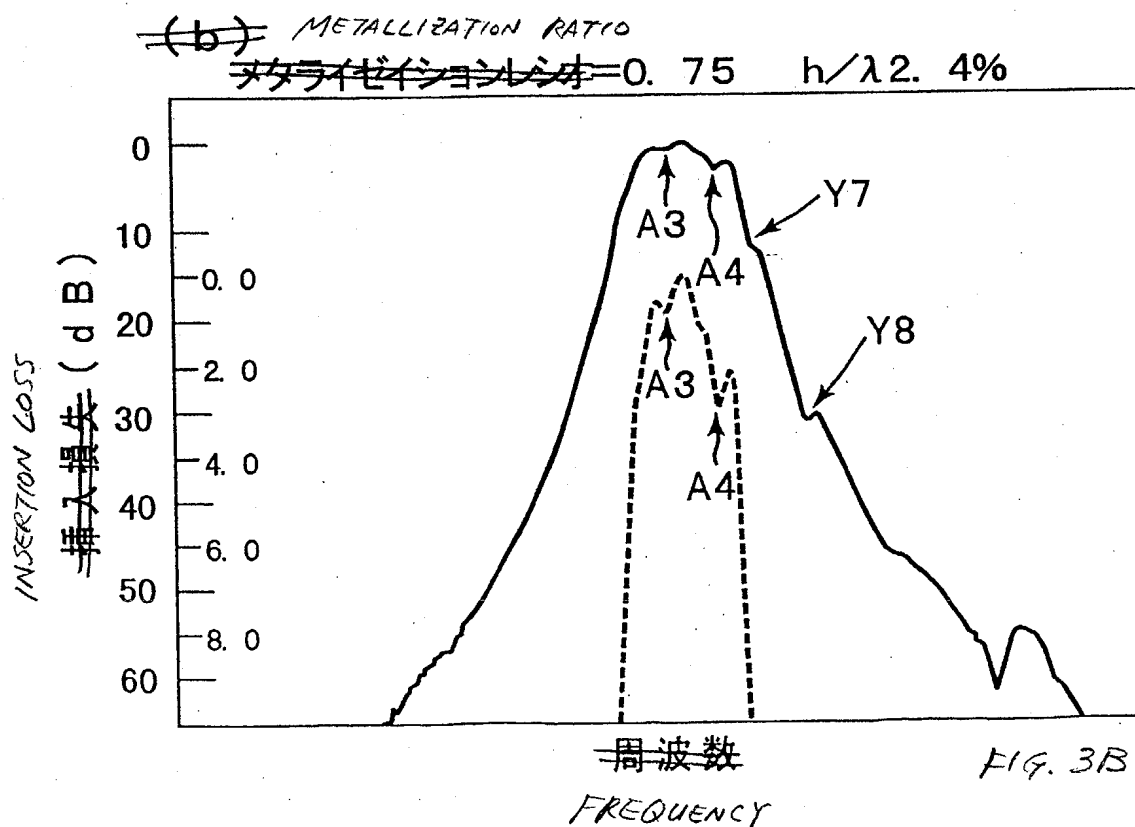
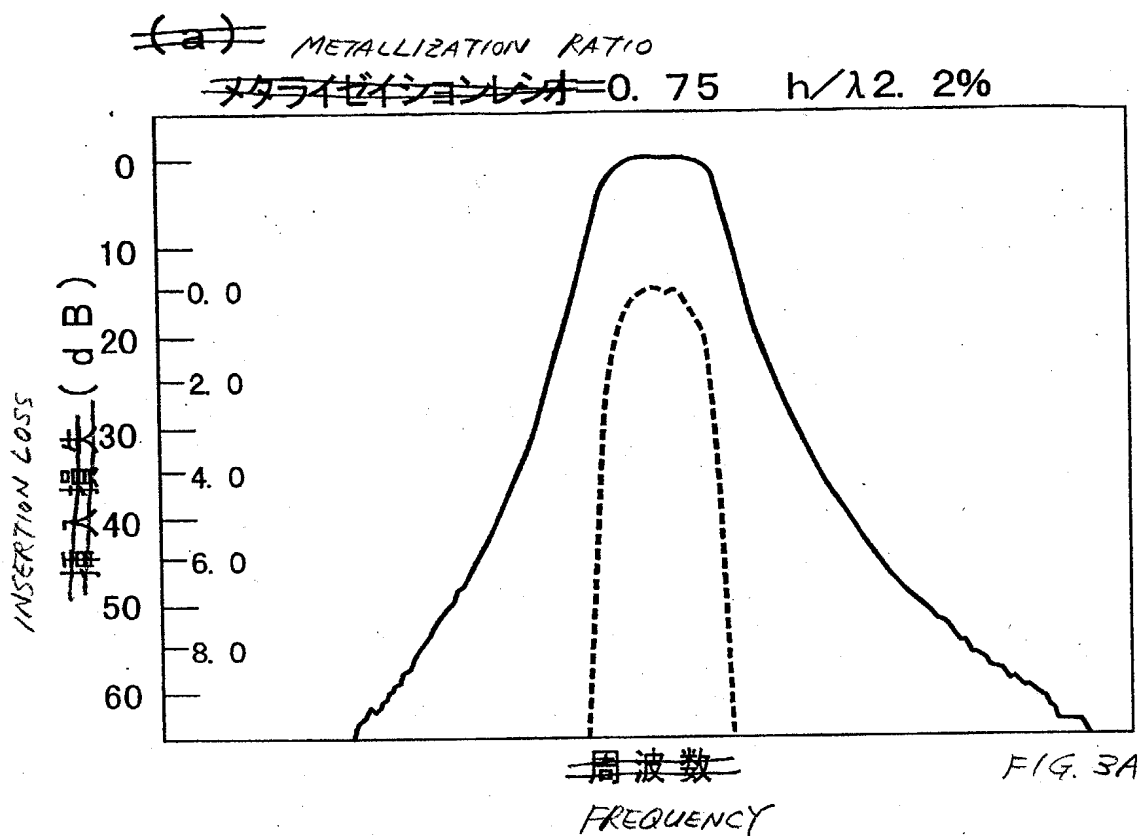
FIG. 1

~~図2~~



0964831-092701

【図3】



METALLIZATION RATIO

$$\text{Ia/水晶の異方性指数} \quad \Delta n_{\text{Ia}} = 0.75$$

整理番号=D P 0 0 0 1 8 1

提出日 平成12年10月27日
特願2000-329341 頁: 4/ 12

REDUCTION IN TRANSVERSE MODE

REMOVAL OF TRANSVERSE MODE

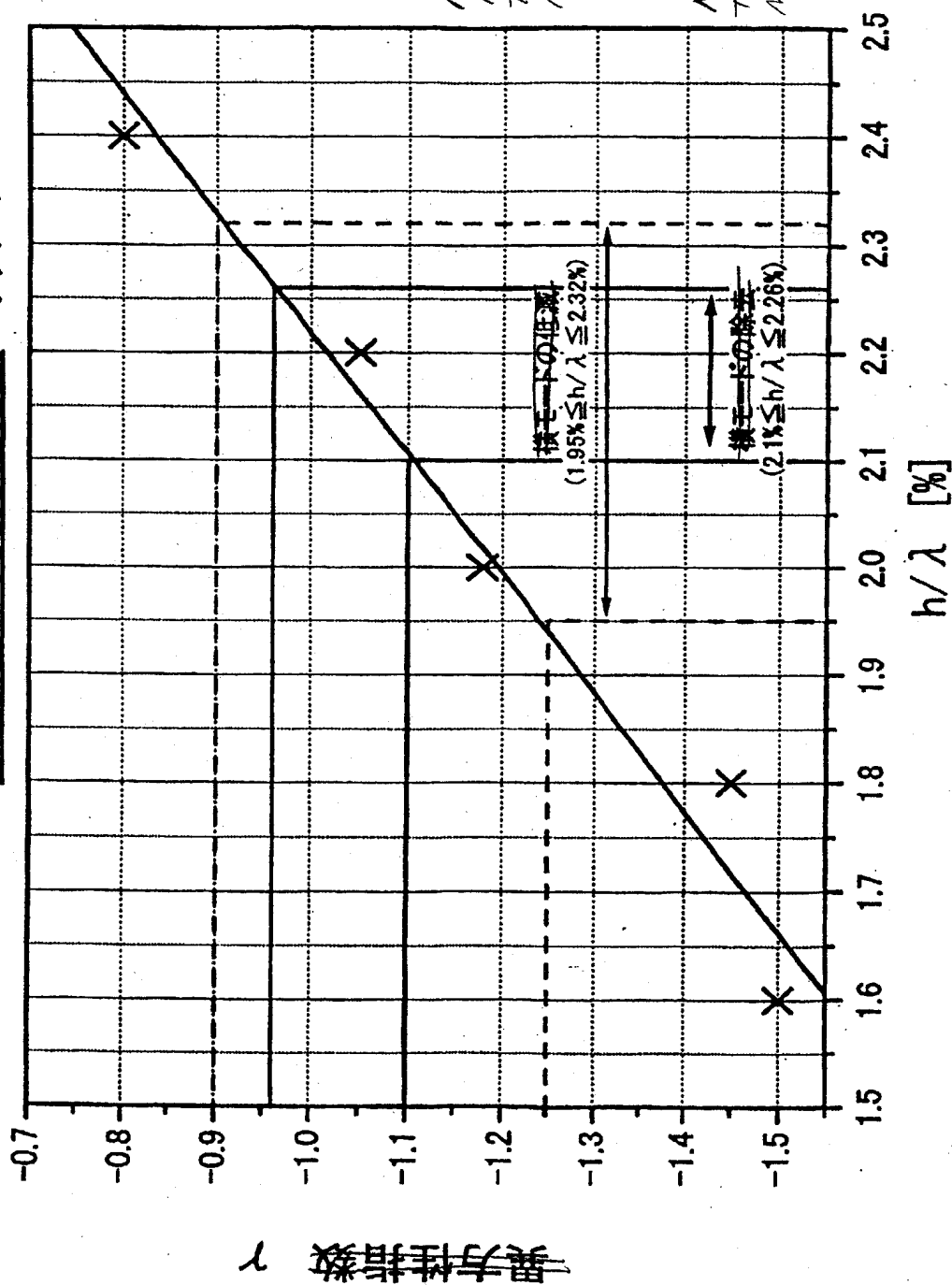


Fig. 4

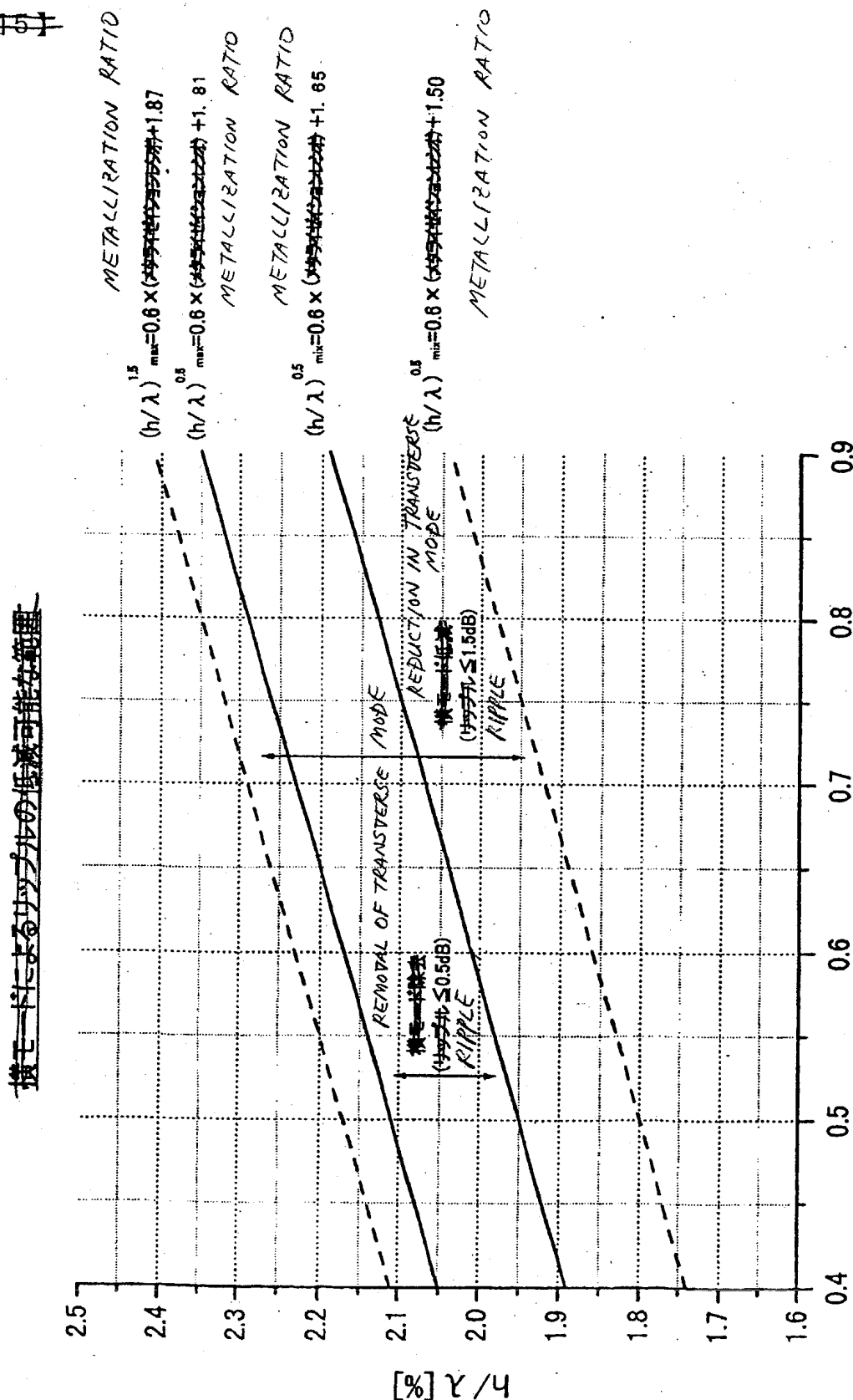
FD260" FEB1966

RANGE WHERE RIPPLE CAUSED BY TRANSVERSE-MODE WAVE CAN BE REDUCED

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日
特願2000-329341 頁: 5/ 12

図5

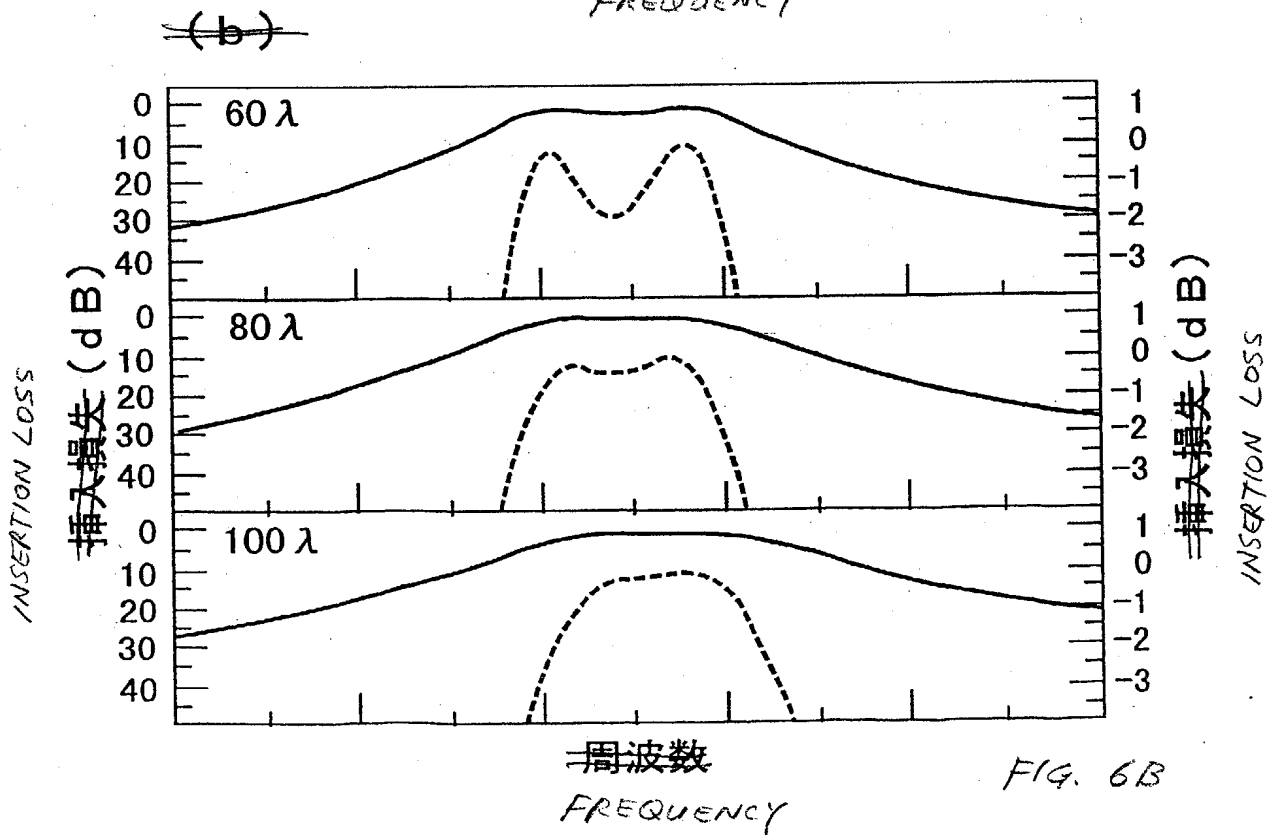
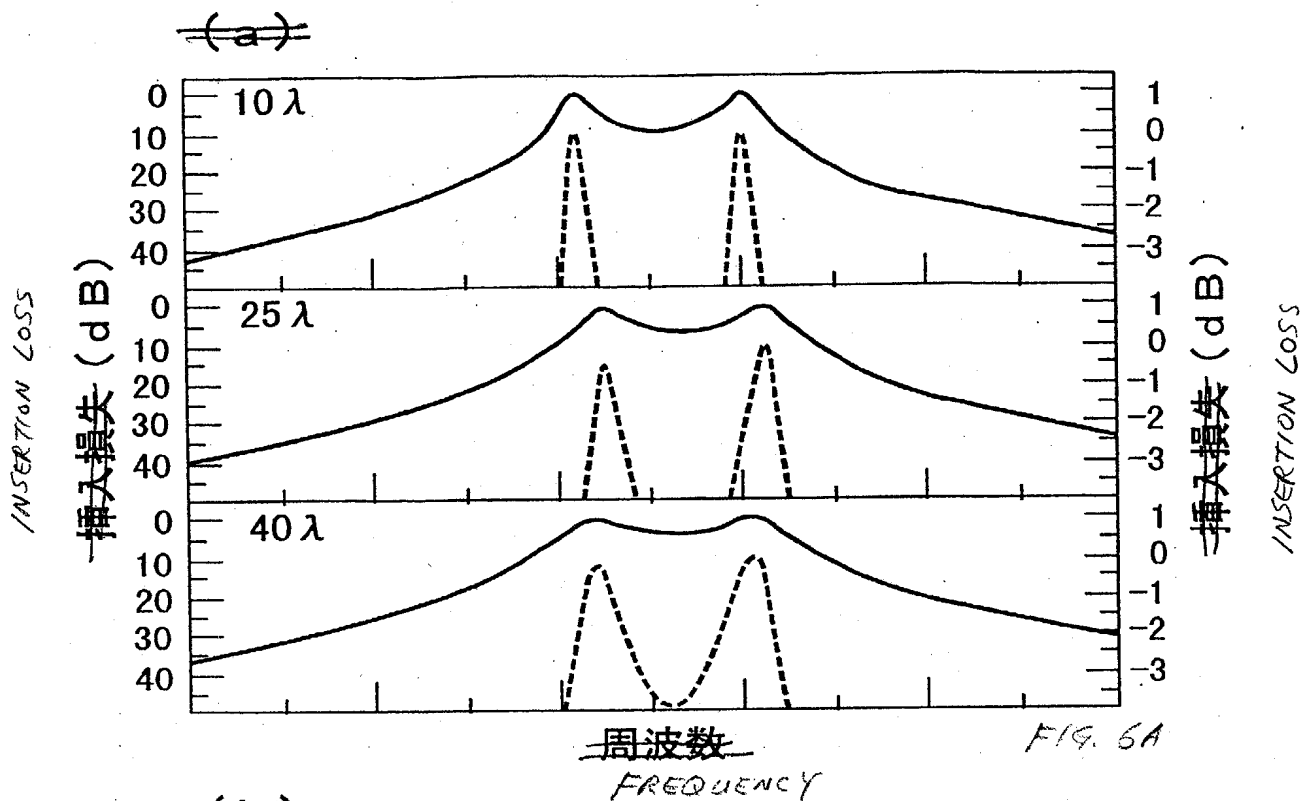


横モードによるリップルの低減可能な範囲

METALLIZATION RATIO

FIG. 5

~~【図6】~~



T04260 TEST#9560

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日
特願2000-329341 頁: 7/ 12

~~図7~~

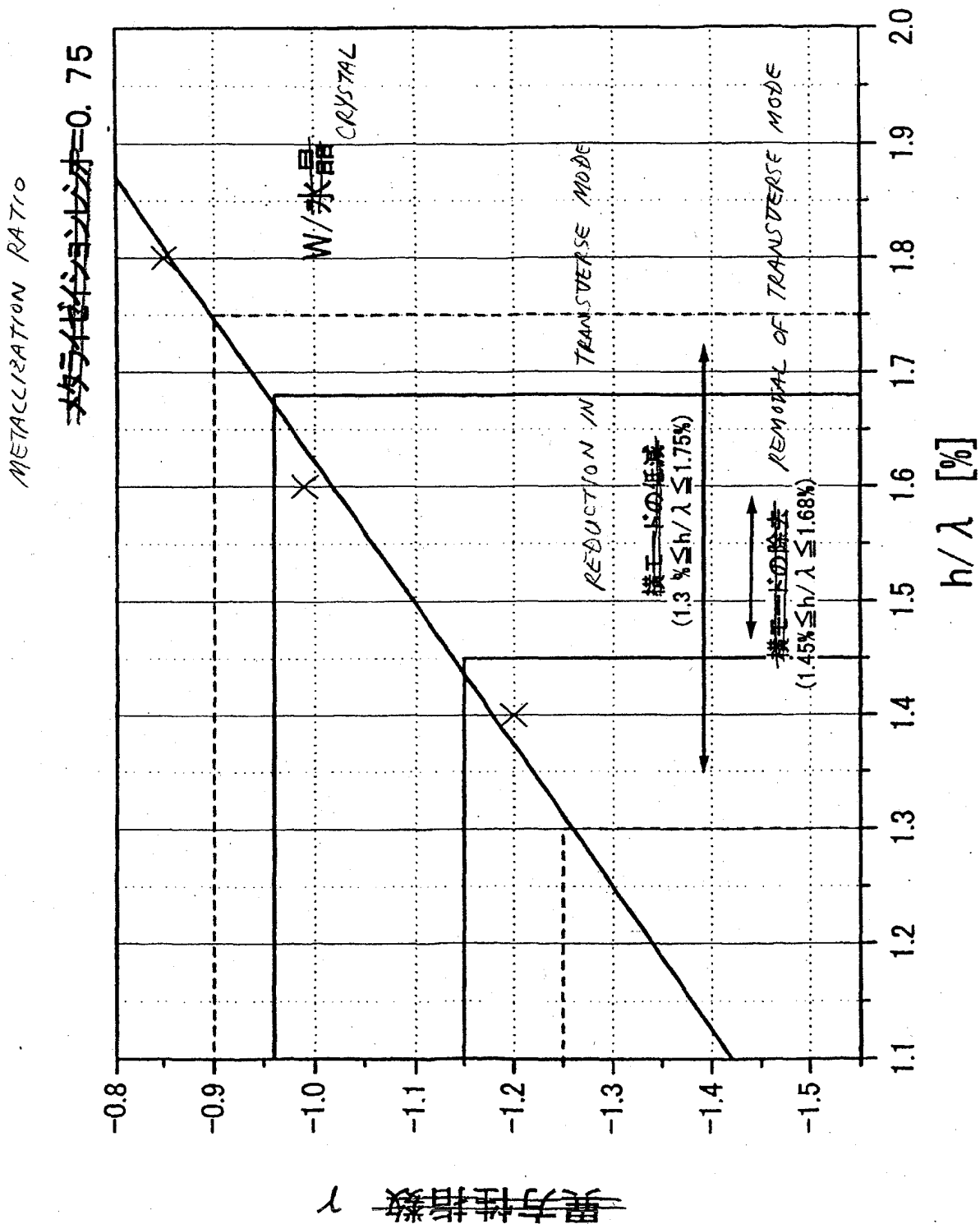


FIG. 7

102260"TE949660

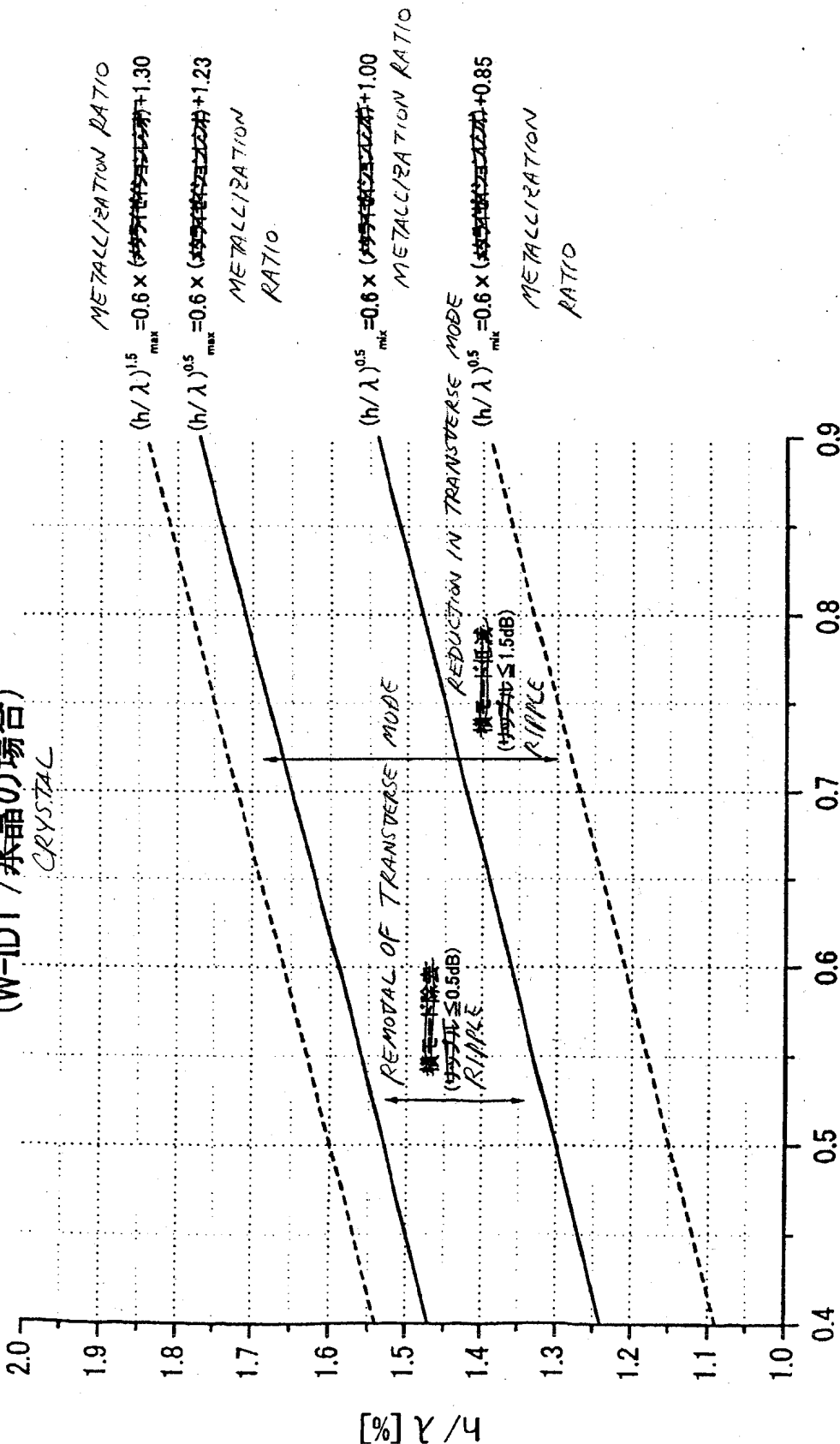
整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日
特願2000-329341 頁: 8/ 12

RANGE WHERE RIPPLE CAUSED BY TRANSVERSE-MODE WADE
CAN BE REDUCED

横モードによるリップルの低減可能な範囲

(W-IDT / 水晶の場合)
CRYSTAL



リップル低減可能な範囲
METALLIZATION RATIO

FIG. 8

【図9】

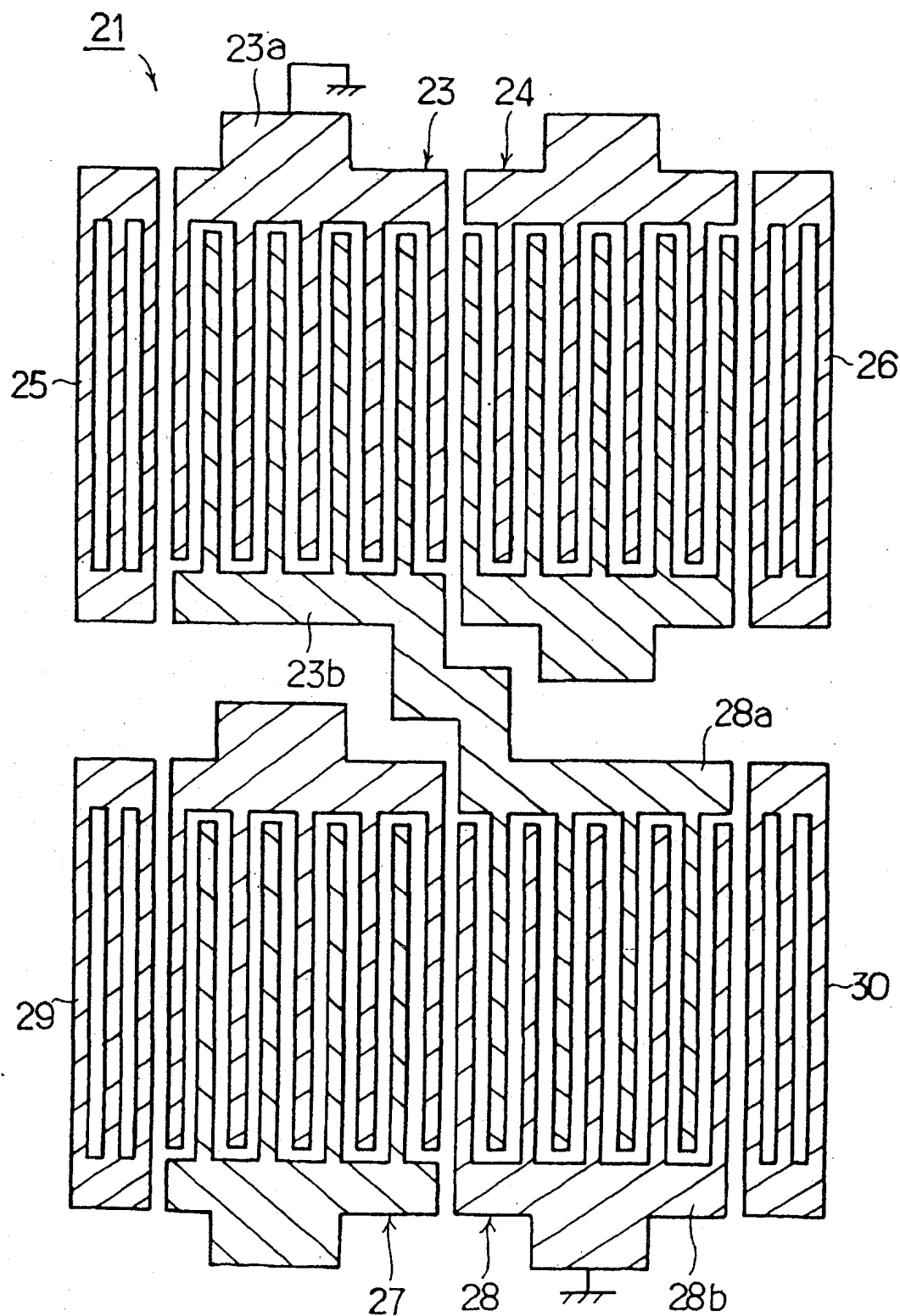


FIG. 9

2025 FEB 26

整理番号=DP000181

提出日 平成12年10月27日
特願2000-329341 頁: 10/ 12

~~図10~~

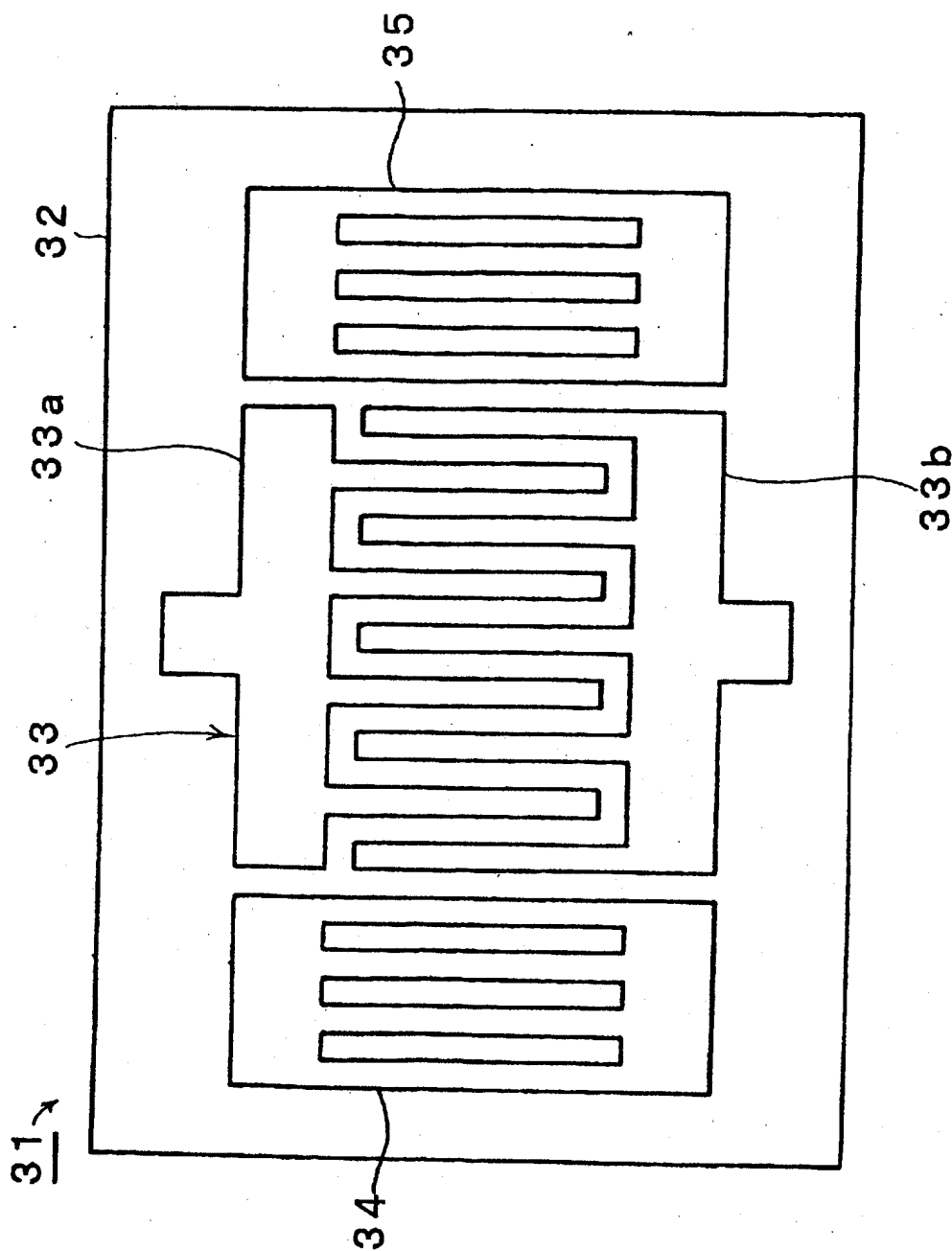


FIG. 10

~~【図11】~~

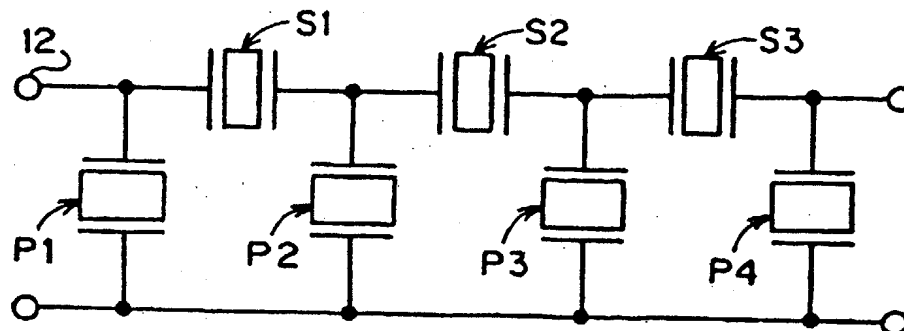


FIG. 11

~~【図12】~~

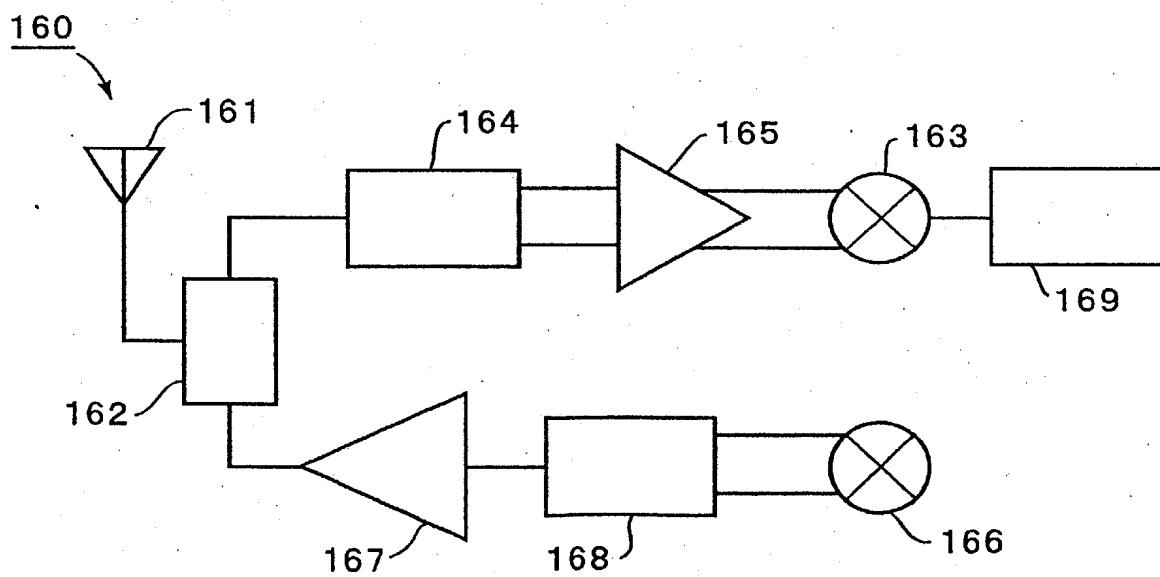


FIG. 12

09064831.092701

3
...

~~【図13】~~

METALLIZATION RATIO

~~メタライゼーション比~~ = 0.75 h/λ 2.50%

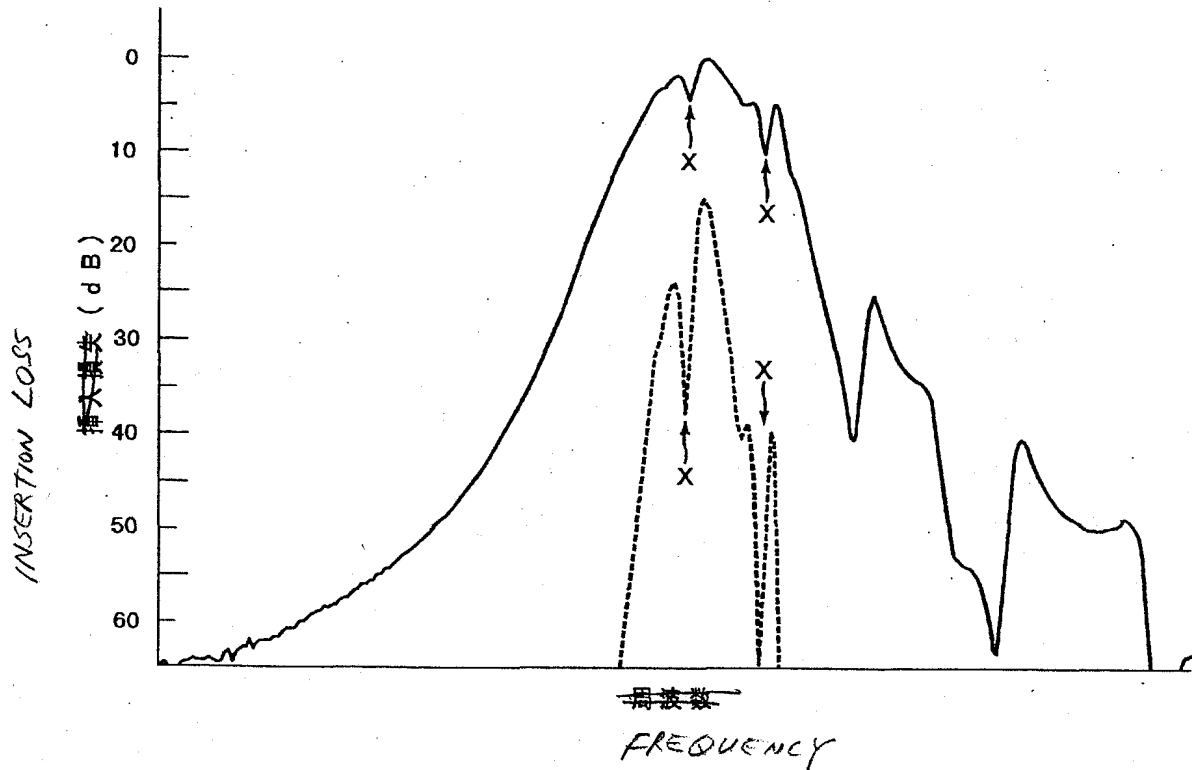


FIG. 13

09964831-092701